

OPTYKA, MECHANIKA PRECYZYJNA I PRZYRZĄDY POMIAROWE	NORMA BRANZOWA	BN-73
	Automatyczne rzutniki do przezroczy	5555-09 W
	Podstawowe parametry i wymagania	Grupa katalogowa XIII 94

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są podstawowe parametry i wymagania dotyczące automatycznych rzutników do przezroczy

1.2 Zakres stosowania normy Postanowienia normy należy stosować przy konstruowaniu oraz w badaniach jakości rzutników automatycznych

1.3 Określenia — wg BN-73/5555-08

1.4 Normy związane

PN-65/N-01253 Metody wyznaczania barw

BN-68/5555-01 Metody pomiaru i obliczania podstawowych parametrów świetlnych projektorów filmowych

BN-70/5555-05 Kryteria oceny jakości obrazów rzutników i episkopów

BN-73/5555-08 Obiektywy rzutników do przezroczy. Parametry i wymagania

2 PODZIAŁ

W zależności od reprezentowanej jakości rzutniki dzielą się na trzy klasy I, II, III

3 WYMAGANIA PODSTAWOWE

3.1 Natężenie oświetlenia mierzone w środku obrazu powinno odpowiadać wartościom podanym w tabl. 1

Tablica 1

Klasa	Najmniejsze natężenie oświetlenia I_x
I	900
II i III	500

Pomiar przeprowadza się wg BN-70/5555-05

3.2 Nierównomierność natężenia oświetlenia ekranu wyraża się stosunkiem natężeń oświetlenia minimalnego do maksymalnego, występujących w polu obrazu. Pomiar przeprowadza się wg BN-68/5555-01

Nierównomierność oświetlenia powinna odpowiadać wartościom podanym w tabl. 2

Tablica 2

Klasa	Nierównomierność natężenia oświetlenia
I	0,75
II	0,60 — 0,74
III	0,50 — 0,59

3.3 Wzrost temperatury w kanale projekcyjnym Temperatura w kanale projekcyjnym po 30 min nieprzerwanej projekcji, przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 20°C, nie powinna przekraczać wartości podanych w tabl. 3

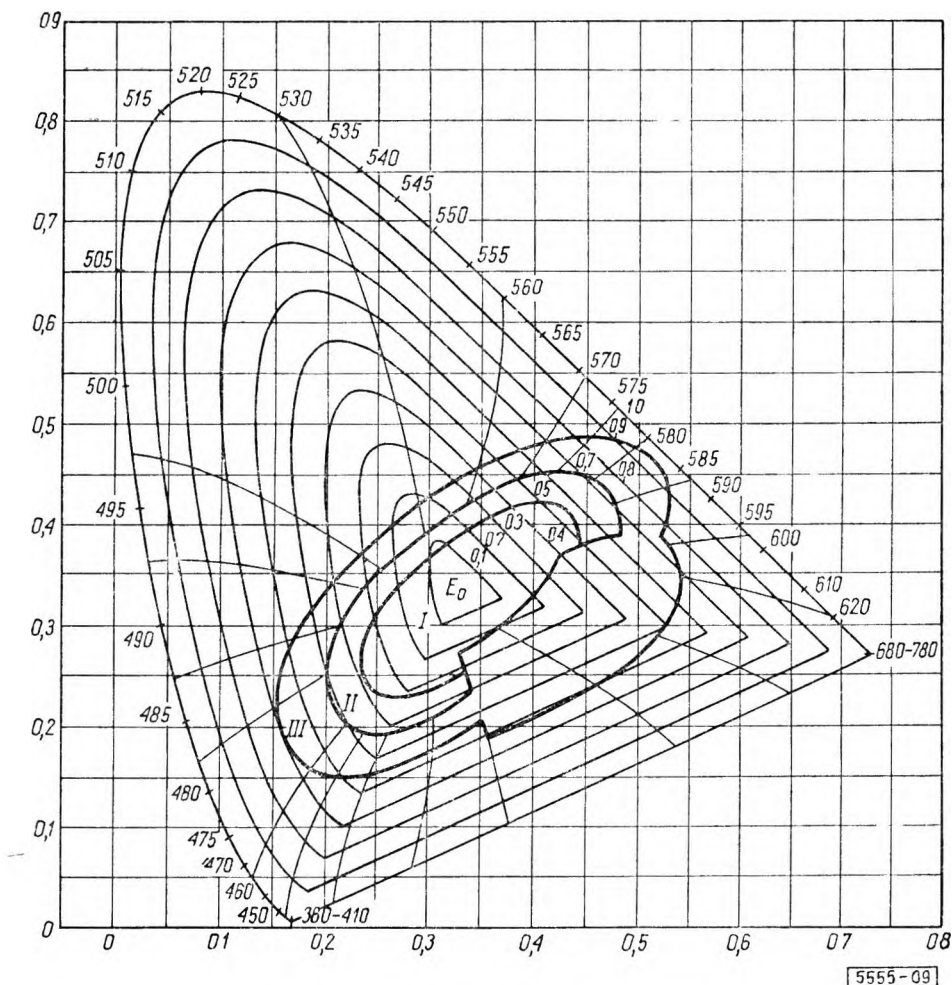
Tablica 3

Klasa	Temperatura, °C
I	60
II	70
III	80

3.4 Białosc światła emitowanego przez układ projekcyjny rzutnika Parametrami określającymi białosc światła są długość fali dominującej i czystość barwy, które wyznaczają się wg PN-65/N-01253. Wyznaczone wartości nanosi się na wykres i z położenia punktu białosci w odpowiedniej strefie określa się klasę rzutnika

Centralne Laboratorium Optyki

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego OMEL dnia 24 listopada 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r. (Dz. Norm. i Miar nr 8/1974 poz. 21)



Wykres stref białosci światła układów projekcyjnych rzutników

3 5 Wzrost temperatury rzutnika Temperatura zewnętrznych powierzchni rzutnika mierzona na wszystkich elementach, oprócz części obudowy lampy i powierzchni znajdujących się w bezpośrednim jej sąsiedztwie, nie powinna przekraczać 60°C dla wszystkich klas rzutników

3 6 Obiektywy do rzutników automatycznych klasy A — wg BN-73/5555-08

3 7 Oporność izolacji mierzona między częściami pod napięciem a częściami metalowymi korpusu nie powinna być mniejsza niż $5\text{ M}\Omega$, przy zastosowaniu 500 V probnika izolacji oporności między przewodami a korpusem przy wejściu napięciowym podczas przełączania każdego przełącznika

3 8 Wytrzymałość elektryczna Izolacja między częściami rzutnika powinna wytrzymać bez prze-

bicia, przeskoku i innych uszkodzeń, napięcie probiercze zmienne 1000 V o częstotliwości 50 Hz w ciągu 1 min

4 WYMAGANIA UŻYTKOWE

Spełnienie wymagań funkcjonalności i przydatności użytkowej rzutnika powinno zapewniać rozwiązanie konstrukcyjne rzutnika, które umożliwia

a) sterowanie rzutnikiem z odległości nie mniejszej niż $3,5\text{ m}$, sterowanie obejmuje zmianę przezrocza przy przesuwie magazynku do przodu i do tyłu oraz nastawienia ostrości,

b) podłączenie do sieci rzutnika ustawionego w odległości co najmniej 3 m od gniazdka wtykowego,

c) wygodne poziomowanie rzutnika,

d) załadowanie co najmniej 36 przezroczy do magazynka

KONIEC